

Problème

Une entreprise est équipée de n machines de production dont chacune a une probabilité de défaillance journalière p_j ainsi qu'un coût de défaillance C_j ; $j = 1, \dots, n$

A. Proportion de machines défaillantes

But: déterminer la probabilité d'avoir moins de d machines défaillantes dans un échantillon de n machines puisées dans une population globale de N machines dont on connaît la probabilité de défaillance p .

La variable aléatoire Y (machine défaillante ou non) suit une distribution de Bernoulli. Il s'agit d'une distribution discrète de probabilité, qui prend la valeur 1 (machine défaillante) avec la probabilité p et la valeur 0 (machine sans défaillance) avec la probabilité $q=1-p$.

$$\text{Espérance: } \bar{Y} = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$

$$\text{Variance: } V(Y) = (1 - p)^2 \cdot p + (0 - p)^2 \cdot (1 - p) = p \cdot (1 - p)$$

On s'intéresse ici à la variable aléatoire $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ ou Y_1, \dots, Y_n est un échantillon de variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Bernoulli mentionnée ci-dessus.

Le caractère quantitatif de S_n est le nombre de machines défaillantes.

On utilise le **Théorème de la limite centrale** :

$$\text{La variable aléatoire } S_n = \sum_{i=1}^n y_i \text{ satisfait } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{S_n - n \cdot \bar{Y}}{\sqrt{n \cdot V(Y)}} \leq b\right) = \int_a^b \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2 \cdot \pi}} dx$$

$$\text{Sous une autre formulation : } \lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \in [a; b]) = \Phi\left(\frac{b - n \cdot \bar{Y}}{\sqrt{n \cdot V(Y)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - n \cdot \bar{Y}}{\sqrt{n \cdot V(Y)}}\right)$$

$$\text{Où : } \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2 \cdot \pi}} dy \text{ (fonction de répartition de la loi normale).}$$

$$\text{Ou encore : } \lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \in [a; b]) = \frac{1}{2} \left(\text{Erf} \left(\frac{b - n\bar{Y}}{\sqrt{2.n.V(Y)}} \right) - \text{Erf} \left(\frac{a - n\bar{Y}}{\sqrt{2.n.V(Y)}} \right) \right)$$

Où : $\text{Erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy$ est la fonction d'erreur.

$$\text{Dans notre cas : } \lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \in [a; b]) = \frac{1}{2} \left(\text{Erf} \left(\frac{b - n.p}{\sqrt{2.n.p.(1-p)}} \right) - \text{Erf} \left(\frac{a - n.p}{\sqrt{2.n.p.(1-p)}} \right) \right)$$

La probabilité recherchée est celle d'avoir moins de d machines défectueuses dans un échantillon de n machines puisées dans une population globale de N machines dont on connaît la probabilité de défaillance p :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \in [-\infty; d]) = \frac{1}{2} \left(\text{Erf} \left(\frac{d - n.p}{\sqrt{2.n.p.(1-p)}} \right) + 1 \right)$$

Exemple : Dans population globale, la probabilité d'avoir une machine défectueuse est de 4%. Quelle est la probabilité de tomber sur moins de 5 machines défectueuses sur un échantillon de 250 machines (soient 2% de défaut)?

$$n = 250$$

$$\bar{Y} = p = 0,04$$

$$V(Y) = p.(1-p) = 0,0384$$

$$d = 5$$

$$P(S_n \in [-\infty; 5]) \cong \frac{1}{2} \left(1 + \text{Erf} \left(\frac{-5}{19,2} \right) \right) = 35,63\%$$

$$\text{Pour moins de 10 machines (4\%), on a : } P(S_n \in [-\infty; 10]) \cong \frac{1}{2} \left(1 + \text{Erf} \left(\frac{0}{19,2} \right) \right) = 50\%$$

$$\text{Pour moins de 20 machines, (8\%), on a : } P(S_n \in [-\infty; 20]) \cong \frac{1}{2} \left(1 + \text{Erf} \left(\frac{10}{19,2} \right) \right) = 76,93\%$$

Question 1 : Ce qui me gêne ici c'est qu'on intègre de $-\infty$ à $+\infty$ alors que des valeurs négatives ne sont pas possibles (on a une probabilité non nulle d'avoir '-x' machines défectueuses). N'y aurait-il pas une condition minimale sur $n.p$ pour que cette estimation soit bonne ? Ne faudrait-il pas normaliser la fonction et considérer

$$P(S_n \in [0;d]) \cong \frac{1}{2} \frac{\operatorname{Erf}\left(\frac{d-n.p}{\sqrt{2.n.p.(1-p)}}\right) - \operatorname{Erf}\left(\frac{0-n.p}{\sqrt{2.n.p.(1-p)}}\right)}{\operatorname{Erf}(\infty) - \operatorname{Erf}\left(\frac{0-n.p}{\sqrt{2.n.p.(1-p)}}\right)}$$

A. Espérance du coût de défaillantes

On s'intéresse ici à la variable aléatoire $D_n = \sum_{i=1}^n C_i Y_i$ ou Y_1, \dots, Y_n est un échantillon de variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Bernoulli (de probabilité p pour toutes) et C_1, \dots, C_n sont les coûts de défaillance respectifs des machines constituant l'échantillon.

Le caractère quantitatif de D_n est le coût global de défaillance.

Question 2 : peut-on étendre le théorème de la limite centrale pour estimer ce caractère quantitatif par :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(A \leq \frac{D_n - E(D_n)}{\sqrt{V(D_n)}} \leq B\right) = \int_A^B \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2.\pi}} dx$$

$$\text{Avec } \begin{cases} E(D_n) = \sum_{i=1}^n C_i . E(Y_i) = \sum_{i=1}^n C_i . p_i = p . \sum_{i=1}^n C_i \\ V(D_n) = \sum_{i=1}^n C_i^2 . V(Y_i) = \sum_{i=1}^n C_i^2 . p_i . (1 - p_i) = p . (1 - p) . \sum_{i=1}^n C_i^2 \end{cases}$$

Si oui, comment le démontrer ?

Si non, y a-t-il un moyen d'estimer la probabilité que le coût soit compris entre deux bornes données ?

Question 3 : même question que ci-dessus mais dans le cas où les Y_1, \dots, Y_n sont des variables aléatoire indépendantes suivant une loi de Bernoulli dont la probabilité p dépend de chaque machine (p_1, \dots, p_n).